

2.0基站产品化测试 - 错误 #3754

17P_T3版本成研院外场meta60 UE接入失败问题

2025-07-16 09:46 - 周立伟

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		

描述

17P_T3版本成研院外场华为meta60 UE接入失败问题：
UE Capability enquiry后无响应，导致UE释放。

历史记录

#1 - 2025-07-16 09:49 - 周立伟

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

定位为UE Capability Info消息超大>3000字节，DU在F1C口处理SCTP发送时丢弃该包，未发到CU，导致UE释放。修改MAX_SCTP_DATA_LEN为4000。